



## 第64回 応用物理学会春季学術講演会 ナノサイエンス株式会社 ランチョンセミナーのご案内

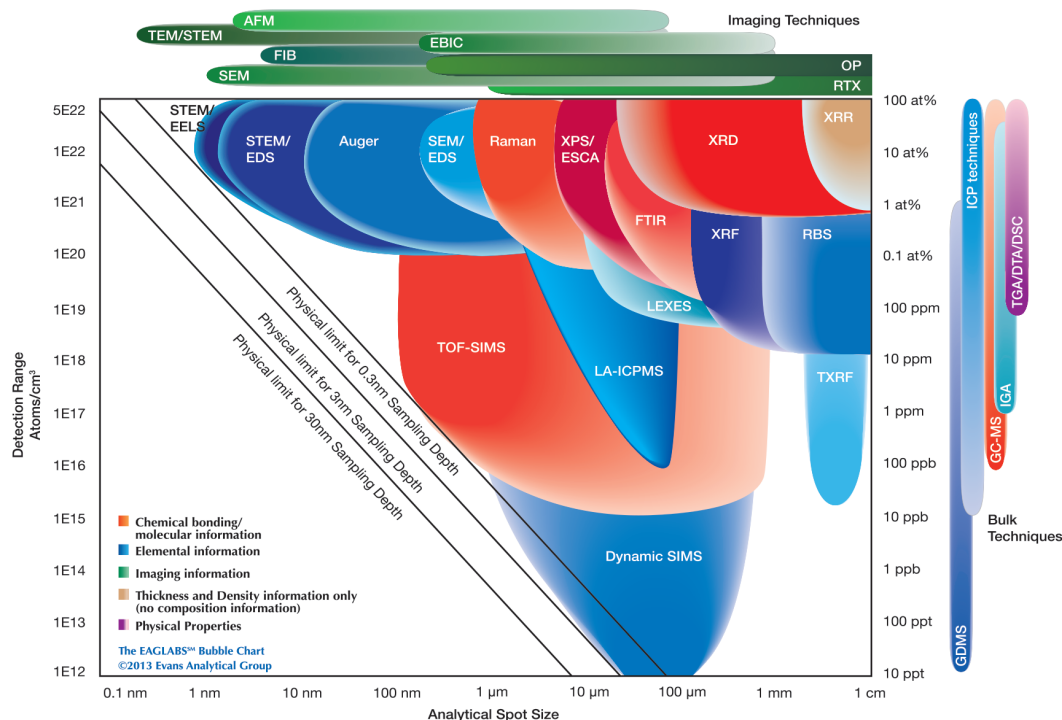
日時: 2017年3月16日(木) 12:00~12:45

場所: 418

### 半導体発光素子の不良個所特定技術と分析事例のご紹介

～ 半導体活性層の不良解析事例と電子顕微鏡(SEM/TEM)による分析事例を中心に ～

#### ◆◆◆各種分析手法の分析範囲◆◆◆ (検出下限と分析面積の関係)



世界の分析リーダーと共に  
日本の産業を支えます

**EAG Inc.**

**Nano Science Corporation**

ナノサイエンス株式会社

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 1-10-1 住友池袋駅前ビル7F

TEL:03-5396-0531

Email: [analysis@eag.com](mailto:analysis@eag.com)